

エポキシ樹脂の定性

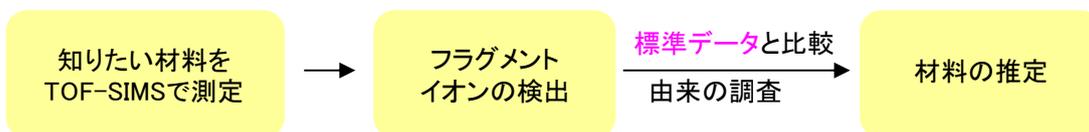
TOF-SIMS分析による成分の推定が可能

測定法 : TOF-SIMS
 製品分野 : 電子部品
 分析目的 : 組成評価・同定

概要

エポキシ樹脂は、優れた機械特性・耐薬品性・電気絶縁性を有することから、プリント基板やIC封止材など電子部品用途として、広く使用されています。エポキシ樹脂の原材料に一般的に用いられるビスフェノール類の試薬について、TOF-SIMSで測定したデータを取得しました。MSTではサンプルの測定データと標準データとを比較することで、検出されたフラグメントイオンが何の成分由来かを調べることができ、エポキシ樹脂に用いられている材料の推定が可能です。

データ



■ビスフェノール類の試薬の標準データ

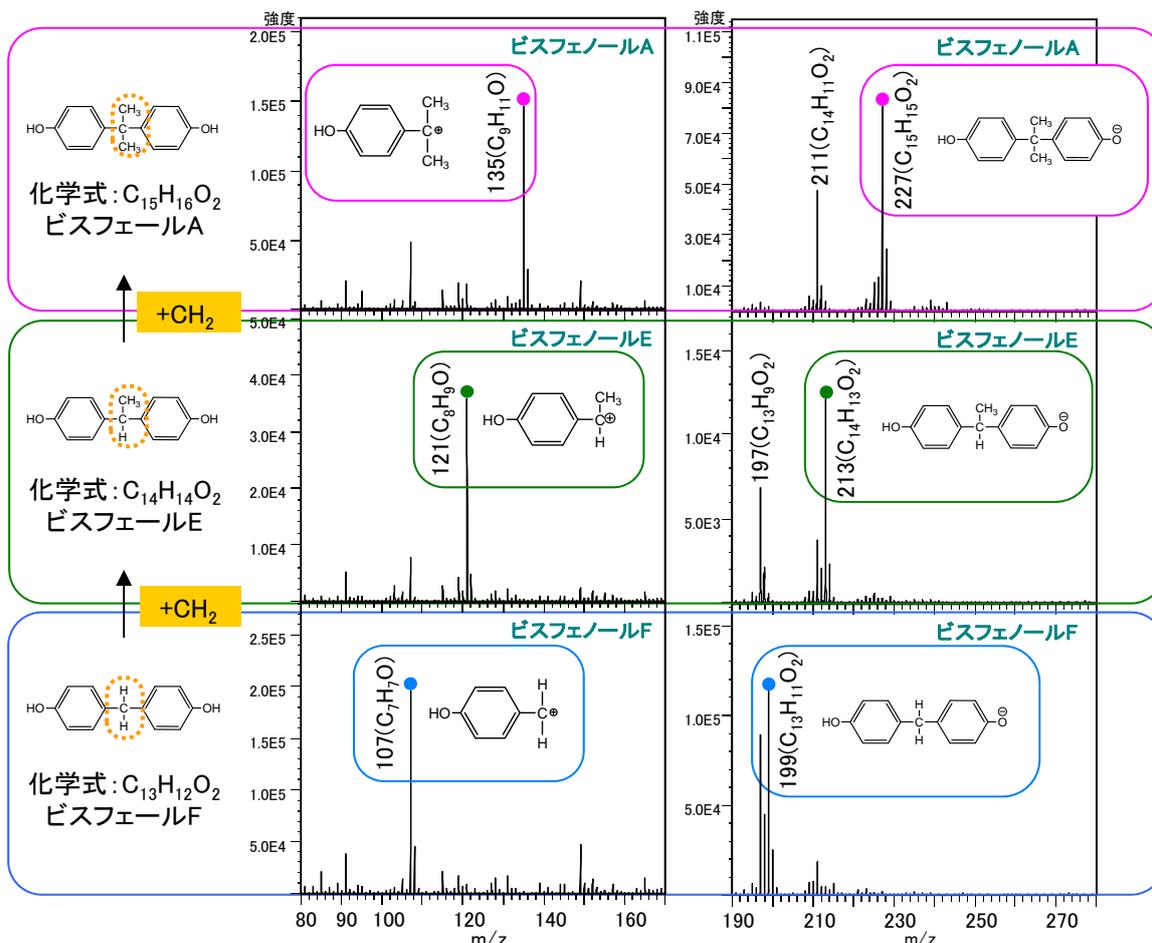


図1 構造式

図2 正イオン定性スペクトル

図3 負イオン定性スペクトル

分析サービスで、あなたの研究開発を強力サポート！

一般財団法人
MST 材料科学技術振興財団

TEL : 03-3749-2525 E-mail : info@mst.or.jp
 URL : <http://www.mst.or.jp/>